

## 2016年第九届中国测试学术会议在江苏南通成功举办

2016-08-02 | 【大中小】【打印】【关闭】

由中国计算机学会（CCF）主办，CCF容错计算专业委员会和南通大学承办的第九届中国测试学术会议于7月22日至24日在江苏省南通市滨江酒店召开。来自中国科学院计算技术研究所、香港中文大学、华为、360、航天科技等单位的230余名代表参加了这次会议，参会人数创会议新高。

CCF容错专委会主任和秘书长分别为我所计算机体系结构国家重点实验室的李华伟研究员和韩银和研究员，本次测试学术会议的大会主席为国重常务副主任李晓维研究员。

会议开幕式由容错计算专委会秘书长、中国科学院计算技术研究所韩银和研究员主持，南通大学副校长丁斐教授、国家自然科学基金委员会信息科学学部副巡视员/战略规划与综合处处长何杰研究员、大会主席李晓维研究员、专委会主任李华伟研究员分别致辞。

本次会议邀请三位IEEE Fellow做大会报告，分别为：希腊雅典大学Dimitris Gizopoulos教授的“Microarchitecture-Level Reliability Assessment”；香港中文大学吕荣聪教授的“Improving Software Reliability by Introducing Diversities among Software: From NVP to NVO”；日本九州工业大学温晓青教授的“Power-Aware LSI Testing: Challenges and Strategies”；三位专家分别从处理器、软件可靠性和集成电路测试三方面分享了他们的观点。

会议安排了八个分会场进行分组报告，50余位代表分享了各自在测试、容错、可信、硬件安全等方面的研究成果。在常规学术论文程序外，还举办了第一届硬件安全论坛和DAC论坛。第一届硬件安全论坛，由我所叶靖博士主持，特邀美国马里兰大学屈钢教授做主题报告，来自360、香港中文大学等单位的8位专家学者做主题报告，论坛还组织了原型展示赛活动，并评选出优秀展示奖。设计自动化会议（DAC）是集成电路领域的顶级会议，会议另辟了DAC论坛，邀请了清华大学、中科院计算所、复旦大学等单位的5位青年学者，报告他们发表在今年DAC上的论文，论坛还组织了“机器学习是否是芯片和EDA的灵丹妙药”Panel，现场讨论气氛非常火爆。

